

NRTW

National **Reliability** Technology Workshop

14 & 15 octobre 2020

IRT St Exupéry / Toulouse



Programme du jeudi 14 octobre

NRTW – Le futur des technologies pour la mobilité

- 13h30 **Accueil**
- 14h00 **Introduction**
- 14h30 **Projet FELINE** - Mohamed MATMAT // IRT Saint Exupery
- 14h50 **Qualification et tenue des boitiers pour la 5G** - Rosine COQ GERMANICUS // MCF laboratoire CRISMAT UMR6508 – INSTITUT CARNOT ESP
- 15h10 **Projet High Volt** - Guillaume BELIJAR // IRT Saint Exupery
- 15h30 **Pause**
- 15h40 **Modélisation multiphysique des connecteurs de puissance** - Tanguy DAVIN // CEVAA Groupe 6NAPSE – INSTITUT CARNOT ESP
- 16h00 **Projet E-PowerDrive** - Bruno NICOLAS //IRT Saint Exupery
- 16h30 **Visite de la plateforme « Electrique » l'IRT Saint Exupery**
 - Electrical Arc Characterization Platform
 - Partial Discharge Characterization Platform
 - Electrical Aging Characterization Platform
 - Power Electronic Platform
 - Electromechanical Drive EMC Platform
 - Soft Magnetic Materials Characterization Platform
- 18h30 **Fin de la visite**
- 19h30 **Dîner sur Toulouse**

[Plus de détails ICI](#)

NRTW

Programme du vendredi 15 octobre

NRTW : La fiabilité du SiC pour des applications de Puissance / HVDC / Montée en tension

- 8h30 **Accueil**
- 9h00 **Expression de besoins face au SiC**
 - *R.MEURET* Safran – *D.DELAUX* Valeo – *M.PITON* Alstom
- 9h30 **Offre des composants SiC par St Microelectronics**
- 10h00 **Pause**
- 10h15 **Présentation du projet SICRET « Silicon Carbide Reliability Evaluation for Transport »**
 - *IRT Saint Exupery* – **Olivier PERROTIN**
- 10h45 **Vision nationale des compétences académiques** // *Mounira BERKANI* – SEEDS
- 11h15 **Robustesse du Mosfet SiC en régime extrême de court-circuit** // *Frédéric RICHARDEAU* – LAPLACE
- 11H45 **Body-diode conduction and MOSFET oxide degradation** // *Hervé MOREL* – AMPERE
- 12h30 **Cocktail Déjeunatoire**
- 13h30 **Power MOSFETs sensitivity to Atmospheric radiation** // *Antoine TOUBOUL* – IES Montpellier
- 14h00 **Mécanismes de défaillance ESD** // *David Trémouilles* – LAAS
- 14h30 **Analyse de défaillance des transistors MOSFET : Du boîtier, jusqu'à l'atome** // *Olivier LATRY* – GPM
- 15h00 **Fiabilité et robustesse des Mosfet-SiC : état de l'art, enjeux et verrous** // *Mounira BERKANI* – SATIE
- 15h30 **La puissance dans FIDES** // *Franck DAVENEL* – DGA
- 16h00 **Challenges posés par l'expertise technologique des composants grands gaps SiC.**
 - *Christian MOREAU* – DGA

[Plus de détails ICI](#)

NRTW

Inscription / Tarif

NRTW

L'accès à cet événement est payant:

- **80€ HT** pour les personnes membres de :
 - *Acsiel / Astech Paris Region / Aerospace Valley / Mov'eo / NAE*
 - *DGA / CNES / IRT St Exupéry / Ministère des Armées*
 - *Aste / CEEES / IEEE France Section / SIA / Comet*
- **160€ HT pour les autres.**

Pour vous inscrire :

<https://www.xing-events.com/NRTW2020.html>

Renseignements / Contact

Contact Organisation :

Samuel CUTULLIC // NAE

François BOUVRY // NAE

Responsable Recherche Technologie & Innovation

rti@nae.fr

02 32 80 90 32

NRTW

Un événement organisé par

